

查询"DF10LC30"供应商

DF10LC30

300V 10A

特長

- SMD
- 低ノイズ
- trr=30ns

Feature

- SMD
- Low Noise
- trr=30ns

用途

- スイッチング電源
- DC/DC コンバータ
- 家電、OA、照明
- 通信、FA
- PDP

Main Use

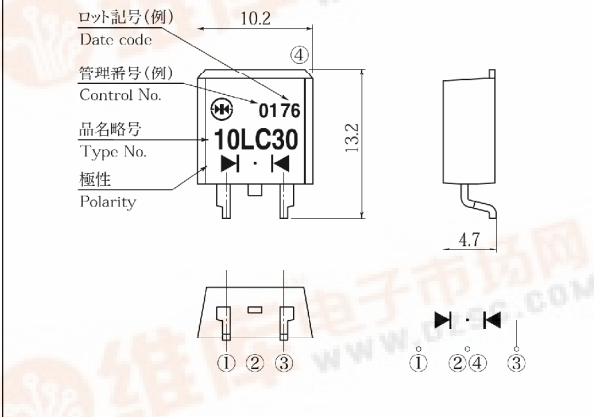
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Office Automation, Lighting
- Communication, Factory Automation
- PDP

■外観図 OUTLINE

Package : STO-220

Unit:mm

Weight 1.5g(Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈ダイオードカタログ・技術資料編〉を参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or the diode technical data book. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

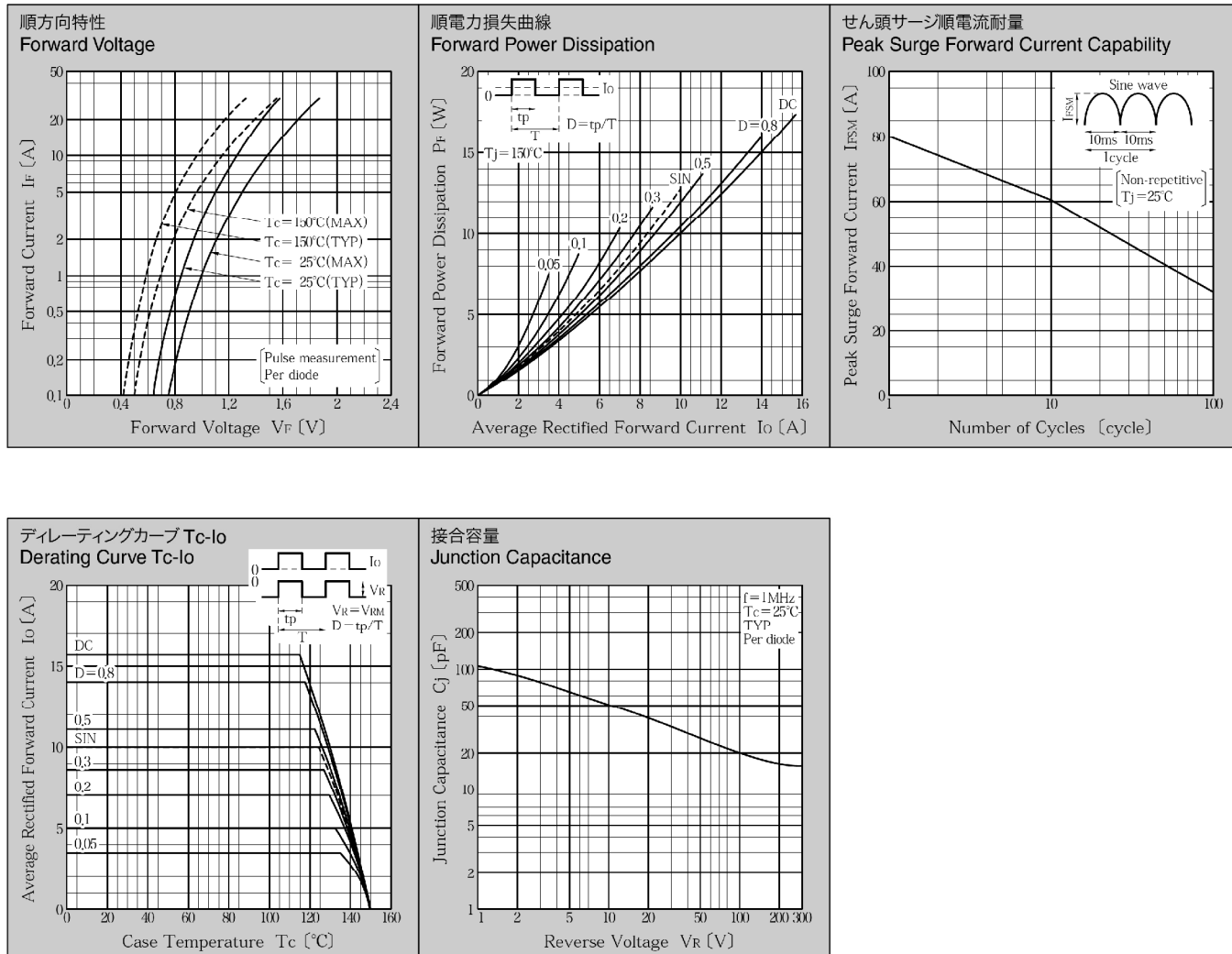
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DF10LC30	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			- 55 ~ 150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			300	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値 I _O /2, T _c = 124℃ 50Hz sine wave, Resistance load, Per diode I _O /2, T _c = 124℃		10	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j = 25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25℃		80	A

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 5 A, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 1.3	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 25	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I _F = 0.5 A, I _R = 1.0 A, 0.25 I _R , 1素子当りの規格値 Per diode	MAX 30	ns
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1 MHz, V _R = 10 V, 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 50	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 2	℃/W

查詢"DF10LC30"供應商

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品は一般的にバラツキを持っています。
 Typical is a statistical average of the device's ability.
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.